

JIS

締結用部品－精度測定方法

JIS B 1071 : 2010

(JFRI/JSA)

平成 22 年 9 月 21 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 機械要素技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	高 増 潔	東京大学
(委員)	相 羽 繁 生	株式会社東郷製作所
	石 丸 尋 士	社団法人自動車技術会
	市 川 直 樹	独立行政法人産業技術総合研究所
	大 橋 宣 俊	日本ねじ研究協会
	高 木 安 廣	NTN 株式会社
	高 辻 利 之	独立行政法人産業技術総合研究所 (東京電機大学)
	田 淵 宏 政	社団法人日本バルブ工業会
	長 江 昭 充	社団法人日本工作機械工業会
	堀 功	日本工具工業会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 60.3.1 改正：平成 22.9.21

官 報 公 示：平成 22.9.21

原 案 作 成 者：日本ねじ研究協会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3436-4988)

財団法人日本規格協会

(〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 二瓶 好正)

審議専門委員会：機械要素技術専門委員会 (委員長 高増 潔)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 測定項目	2
4 測定方法	3
4.1 ねじ	3
4.2 寸法公差付き形体	5
4.3 幾何公差付き形体	14
附属書 A (参考) トリロールジグ (一例)	23
解 説	24

まえがき

この規格は、工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき、日本ねじ研究協会（JFRI）及び財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって、**JIS B 1071:1985** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任はもたない。

締結用部品—精度測定方法

Fasteners—Methods of verification for size and geometry

1 適用範囲

この規格は、JIS B 1021 に基づいて、締結用部品に与えられた寸法公差及び幾何公差に関する特性の測定方法について規定する。

測定方法は、実測による方法、ゲージによる方法又は比較による方法とする。

注記 被測定部品の軸部を保持して回転させるために使用するジグの例を附属書 A に示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

- JIS B 0251 メートルねじ用限界ゲージ
- JIS B 1012 ねじ用十字穴
- JIS B 1013 皿頭ねじ—頭部の形状及びゲージによる検査
- JIS B 1015 おねじ部品用ヘキサロビュラ穴
- JIS B 1016 六角穴のゲージ検査
- JIS B 1021 締結用部品の公差—第 1 部：ボルト、ねじ、植込みボルト及びナット—部品等級 A, B 及び C
- JIS B 1194 六角穴付き皿ボルト
- JIS B 7153 測定顕微鏡
- JIS B 7184 測定投影機
- JIS B 7502 マイクロメータ
- JIS B 7503 ダイヤルゲージ
- JIS B 7507 ノギス
- JIS B 7515 シリンダゲージ
- JIS B 7516 金属製直尺
- JIS B 7520 指示マイクロメータ
- JIS B 7524 すきまゲージ
- JIS B 7533 てこ式ダイヤルゲージ
- JIS B 7540 V ブロック
- JIS B 7544 デプスマイクロメータ